

O B S A H

Rejstřík autorů	str.	6
Úvod		7
SEKCE I-PERSPEKTIVY DIAGNOSTIKY A MIKROELEKTRONIKY		
1. Neuronové sítě - nová architektura výpočetních systémů odolných proti poruchám P. Golan, VÚMS Praha . . .		11
2. Vývojové tendence osobních počítačů K. Janů, VÚAP Praha . . .		19
3. Akcelerátory pro osobní počítače P. Slaba, ČVUT - FEL Praha . . .		36
4. Generování pseudonáhodných testů v počítači EC 1120 O. Novák, VÚMS Praha		46
SEKCE II - VYUŽITÍ OSOBNÍCH POČÍTAČŮ V DIAGNOSTICE		
5. Personální měřicí přístroje M. Pavel, J. Vacovská, J. Pavlín, VÚMS Praha. . .		50
6. Sběrnice osobních počítačů IBM K. Uhlíř, VÚMS Praha . . .		61
7. Připojení nových periferních zařízení k počítačům ekvivalentním s IBM PC P. Ryšavý, VÚMS Praha . . .		72
8. Oživování a diagnostika palubního počítače pomocí IBM PC I. Svoboda, TESLA IMA Praha . . .		76
9. Servisní a diagnostická stanice SDS počítače EC 1120 Z. Fixa, P. Procházka, VÚMS Praha . . .		80
10. Televizní měřicí systém TMS M. Vlasák, VÚMS Praha . . .		84
SEKCE III - ZABEZPEČENÍ PROTI PORUCHÁM		
11. Detekce chyb v procesoru zbytkovým kódem V. Drábek, FE - VUT Brno . . .		87
12. Multiprocessorový systém zabezpečený proti poruchám J. Tomlain, VÚ 010/05 Záhorie . . .		186
SEKCE IV - GENEROVÁNÍ TESTŮ		
13. Systém automatického generovania funkčného testu z RTL opisu E. Gramatová, ÚTK SAV Bratislava . . .		91
14. Opis jazyka RT P. Benčura, M. Fischerová, ÚTK SAV Bratislava . . .		95
15. Model porúch na úrovni RT M. Duda, ÚTK SAV Bratislava . . .		99

16. S - algoritmus A. Kotešová, ÚTK SAV Bratislava	103
17. Strategie analýzy testovatelnosti na úrovni RTL Z. Kotásek, FE VUT Brno	107
18. Automatizované generování diagnostických testů A. Zrostlík, Kancelářské stroje Teplice	111

SEKCE V - VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

19. Použití metod umělé inteligence k diagnostice mikro- elektronických systémů J. Kokeš, M. Valášek, ČVUT-FSI Praha	115
20. Expertní systémy pro vestavěnou diagnostiku R. Starosta, ČVUT FEL Praha	125
21. Aplikace systému FEL- EXPERT pro osobní počítače v úlohách technické diagnostiky P. Měříčka, VS Práce, Praha	130

SEKCE VI - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

22. Modulární testovací systém R. Kolliner, K. Uhlíř, VÚMS Praha	134
23. Metrologická nadváznost kalibrovatelného testovacího systému Ľ. Kontšek, J. Kuniak, ZVT Banská Bystrica	138
24. Výrobní diagnostika jednodeskového počítače R. Bukovský, Laboratorní přístroje Praha	142
25. Testování disketových pamětí osobních počítačů J. Kupka, VÚMS Praha	146
26. Diagnostika činnosti mikropočítače na letounu L 610 V. Dvořák, Jihostroj Velešín	150
27. Využití sériové komunikace pro diagnostiku řídicího mikropočítače leteckého motoru A. Lukeš, Jihostroj Velešín	154

SEKCE VII - SPOLEHLIVOST MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ

28. Sledování technické spolehlivosti v pražském metru M. Ritschel, V. Ovsík, ZPA Čakovice	158
29. Zvyšovanie spoľahlivosti viacprocesorového systému určeného pre riadenie procesov v reálnom čase S. Dínuš, M. Jurík, UTK-SAV Bratislava	162
30. Kdy zvyšovat spolehlivost mikropočítačů I. Krča, Kancelářské stroje Brno	166

31. Zvyšování odolnosti proti poruchám v poli procesorů
VLSI (WSI) . . . 170
V. Heřt, ČVUT FEL Praha

SEKCE VIII - DIAGNOSTIKA OBVODŮ LSI A VLSI

32. Testování mikropočítače MHB 8751 . . . 174
A. Pleštil, J. Velich, P. Slavík, Tesla VÚST Praha
33. Test mikropočítače MHB 8751 v assembleru a jeho
simulace . . . 178
A. Müller, J. Zápalka, J. Ábel, Tesla VÚST Praha
34. Testování nové generace IO pro barevné TVP . . . 182
D. Grůza, M. Šimíček, Tesla Rožnov